

РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В МНОГОБАРЬЕРНЫХ СТРУКТУРАХ $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$

С. Н. Гриняев, В. Н. Чернышов

Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова при Томском государственном университете, 634050, Томск, Россия
(Получена 3.03.1992. Принята к печати 21.05.1992)

Рассмотрена задача о прохождении электронов через многослойные полупроводниковые структуры. Для вычисления коэффициентов прохождения $P(E)$ на основе метода матрицы рассеяния получены удобные для численных расчетов рекуррентные соотношения. С использованием метода модельного псевдопотенциала проведен расчет $P(E)$ для двухбарьерных структур GaAs/AlAs и $\text{GaAs}/\text{Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{As}$ при нормальном к гетерограницам падении электронов для энергий выше E_c GaAs на величину до 1 эВ. Проведен анализ особенностей в $P(E)$. Изучены границы применимости часто используемого для расчета $P(E)$ приближения эффективной массы. Показано, что для описания туннелирования электронов в GaAs/AlAs при $E > E_{X_1}$ (AlAs) необходимо, кроме Γ -состояний, учитывать X_1^+ - и X_3^+ -состояния.

Теоретическое описание процессов туннелирования в многослойных полупроводниковых структурах в настоящее время в большинстве исследований проводится в рамках метода эффективной массы. Применение такого подхода, оправданное в основном для систем с выделенной в интересующем нас интервале энергий долиной, наталкивается на трудности, связанные с заданием условий сшивания на гетерогранице. До сих пор эта проблема не имеет обоснованного решения. Предпринятые в последнее время попытки моделирования электронных состояний на основе методов псевдопотенциала [1-4] и сильной связи [3-5] показали, что в ряде случаев однодолинное приближение метода эффективной массы дает неправильные результаты.

В настоящей работе приводятся результаты расчетов коэффициентов прохождения $P(E)$ электронов в структурах $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, выполненных по методу псевдопотенциала в широком энергетическом интервале, где реализуются два канала рассеяния (Γ и X). Установлена связь наблюдаемых в $P(E)$ особенностей с решениями задач для изолированных ям и барьеров. Проведено сравнение с результатами для более простых моделей. Определен минимальный набор состояний, достаточный для адекватного описания процессов туннелирования.

Будем считать, что плоскости $z = z_n$ ($n = 1, 2, \dots, N$) являются гетерограницами для кристаллов с номерами l_n (слева от границы $z = z_n$) и l_{n+1} (справа от границы $z = z_n$), где $l_n = 1, 2, \dots, L$; $L \ll N + 1$. В области $z \leq z_1$ находится вещество типа l_1 , в области $z \geq z_N$ — типа l_{N+1} . Гамильтониан всей системы H можно представить в виде суммы гамильтонианов H_{l_n} отдельных подсистем

$$H = \sum_{n=1}^{N-1} \Theta(z - z_n) \theta(z_{n+1} - z) H_{l_{n+1}} + \Theta(z_1 - z) H_{l_1} + \Theta(z - z_N) H_{l_{N+1}}. \quad (1)$$

В общем случае H_{l_n} могут отличаться от гамильтонианов для неограниченных веществ типа l_n . Эти отличия, связанные в основном с изменениями в электростатической части потенциала и со структурными дефектами в окрестности

гетерограниц, наиболее существенны на расстояниях порядка нескольких атомных слоев от гетерограниц. Однако рассматриваемые нами гетероструктуры относятся к тем немногочисленным идеальным системам, в которых эффекты рассогласования решеток и влияние приграничных диполей не играют определяющей роли в потенциале, что подтверждается результатами самосогласованных расчетов зонных спектров сверхрешеток [6]. Кроме того, изучаемые структуры образованы достаточно протяженными подсистемами. Поэтому мы в своей работе используем модель с разрывными на гетерограницах потенциалами, считая, что H_{l_n} — гамильтониан идеального неограниченного типа l_n . В выбранной нами модели сохраняется трансляционная симметрия в направлениях, параллельных гетерограницам, поэтому параллельная плоскостям $z = \text{const}$ компонента волнового вектора k_{\parallel} будет квантовым числом. Таким образом, все величины в наших дальнейших формулах являются функциями k_{\parallel} и энергии E .

Общее решение уравнения Шредингера для $z_{n-1} \leq z \leq z_n$ можно представить в виде (для $n = 1$ $z_0 = -\infty$, для $n = N + 1$ $z_{N+1} = \infty$)

$$\psi^{l_n}(\rho, z) = \sum_{\nu} A_{\nu}^n \psi_{\nu}^{l_n}(\rho, z) + \sum_{\mu} B_{\mu}^n \psi_{\mu}^{l_n}(\rho, z), \quad (2)$$

где $\psi_{\nu}^{l_n}(\rho, z)$ и $\psi_{\mu}^{l_n}(\rho, z)$ — частные решения уравнения Шредингера с гамильтонианом H_{l_n} :

$$\psi_{\nu}^{l_n}(\rho, z) = \exp(ik\rho) \exp(ik_{z\nu}^{l_n}(\mu)) U_{k_{z\nu}^{l_n}(\mu)}(\rho, z), \quad (3)$$

где ρ — совокупность координат x и y , $U(\rho, z)$ — периодические функции. Индекс ν нумерует функции с $\text{Im } k_z = 0$ и групповой скоростью $v_{\nu} = (\partial E / \partial k_z)_{k_z=k_{z\nu}} > 0$, а также функции с $\text{Im } k_z > 0$; индекс μ — функции с $\text{Im } k_z = 0$ и $v_{\mu} = (\partial E / \partial k_z)_{k_z=k_{z\mu}} < 0$, а также $\text{Im } k_z < 0$. Ясно, что ν соответствует состояниям, распространяющимся на ∞ или затухающим при $z \rightarrow \infty$. Такую совокупность волн в дальнейшем будем называть падающими волнами. Индекс μ описывает отраженные блоховские волны, т. е. состояния, распространяющиеся на $-\infty$ или затухающие при $z \rightarrow -\infty$.

На гетерограницах $z = z_n$ для функций $\psi^{l_n}, \psi^{l_{n+1}}$ и их нормальных к границам производных должны выполняться условия спшивания, которые удобно представить в матричном виде

$$\begin{pmatrix} A^n \\ B^n \end{pmatrix} = \left(L^{l_n}(n) \right)^{-1} J(n) L^{l_{n+1}}(n) \begin{pmatrix} A^{n+1} \\ B^{n+1} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где A^n и B^n — векторы-столбцы с компонентами A_{ν}^n и B_{μ}^n соответственно, $L^{l_m}(n)$ и $J(n)$ — блочные матрицы:

$$L^{l_m}(n) = \begin{pmatrix} L_1^{l_m}(n) & 0 \\ 0 & L_2^{l_m}(n) \end{pmatrix}, \quad J(n) = \begin{pmatrix} J_{11}(n) & J_{12}(n) \\ J_{21}(n) & J_{22}(n) \end{pmatrix},$$

где

$$[L_1^{l_m}]_{12} \delta_{\nu(\mu), \nu'(\mu')} = \delta_{\nu(\mu), \nu'(\mu')} \exp(ik_{z\nu}^{l_m}(\mu) z_n),$$

$$J_{12}(n) = (Q_{l_m}^{l_p})^{-1} (W_{l_m}^{l_p} W_{3^{l_m}-1}^{l_p})^{-1} (W_{l_m+1}^{l_p+1} - W_{3^{l_m}-1}^{l_p}) Q_{l_m+1}^{l_p+1},$$

$$W_i^{l_p} = D_i^{l_p} (Q_i^{l_p})^{-1},$$

$$[D_{1(2)}^{I_n}]_{\alpha\nu(\mu)} = \sum_s C_{\alpha s\nu(\mu)}^{I_n} \exp(ib_{zs} z_s),$$

$$[Q_{1(2)}^{I_n}]_{\alpha\nu(\mu)} = i \sum_s C_{\alpha s\nu(\mu)}^{I_n} (k_{z\nu(\mu)}^{I_n} + b_{zs}) \exp(ib_{zs} z_s),$$

$i, j = 1, 2$; $C_{\alpha s\nu(\mu)}^{I_n}$ — коэффициенты разложения периодических частей блоховских функций по плоским волнам $\exp(ib_{as}r)$, $b_{as} = b_a + b_{zs}$ (b_a параллельны гетерограницам).

Задачей теории рассеяния является установление связи между амплитудами волн слева от многослойной системы (область $z \leq z_1$) и справа от нее (область $z \geq z_N$), т. е. между коэффициентами A^1, B^1 и A^{N+1}, B^{N+1} . В широко распространенных простых модельных расчетах такая связь находится с помощью так называемой матрицы переноса [1]. Однако, как указано, например, в [2], метод матрицы переноса становится непригодным для расчетов реальных трехмерных структур. Для таких расчетов следует использовать метод матрицы рассеяния, в котором связь между вышеуказанными коэффициентами ищется в виде

$$\begin{pmatrix} A^{N+1} \\ B^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}(N) & S_{12}(N) \\ S_{21}(N) & S_{22}(N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^1 \\ B^{N+1} \end{pmatrix} = S(N) \begin{pmatrix} A^1 \\ B^{N+1} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где $S(N)$ — матрица рассеяния. Для определения матриц $S_{ij}(N)$ ($i, j = 1, 2$) в работе [2] получены рекуррентные соотношения. Однако эти соотношения не очень удобны для численных расчетов, поскольку в них при достаточно больших z_s и $|Im k_z|$ возникают экспоненциально большие величины. Для устранения проблем мы ввели матрицы $y(n)$, $x(n)$ и $u(n)$, связанные с матрицей рассеяния соотношениями

$$\begin{aligned} S_{11}(n) &= [L_1^{I_n+1}(n+1)]^{-1} y(n), \\ S_{12}(n) &= [L_1^{I_n+1}(n+1)]^{-1} x(n) L_2^{I_n+1}(n), \\ S_{22}(n) &= u(n) L_2^{I_n+1}(n+1). \end{aligned} \quad (6)$$

С использованием (6) рекуррентные соотношения из [2] примут вид

$$\begin{aligned} y(n) &= L_1^{I_n+1}(n+1) [L_1^{I_n+1}(n)]^{-1} [J_{11}(n) - x(n-1) J_{21}(n)]^{-1} y(n-1), \\ x(n) &= L_1^{I_n+1}(n+1) [L_1^{I_n+1}(n)]^{-1} [J_{11}(n) - x(n-1) J_{21}(n)]^{-1} \times \\ &\quad \times [x(n-1) J_{22}(n) - J_{12}(n)] L_2^{I_n+1}(n) [L_2^{I_n+1}(n+1)]^{-1}, \\ u(n) &= u(n-1) \{J_{21}(n) [J_{11}(n) - x(n-1) J_{21}(n)]^{-1} \times \\ &\quad \times [x(n-1) J_{22}(n) - J_{12}(n)] + J_{22}(n)\} L_2^{I_n+1}(n) [L_2^{I_n+1}(n+1)]^{-1}, \end{aligned} \quad (7)$$

$$S_{21}(n) = S_{21}(n-1) + u(n-1) J_{21}(n) [J_{11}(n) - x(n-1) J_{21}(n)]^{-1} y(n-1),$$

$n = 1, 2, \dots N$. Начальными условиями для (7) являются

$$x(0) = S_{21}(0) = 0,$$

$$y(0) = L_1^{I_1}(1), \quad u(0) = [L_2^{I_1}(1)]^{-1}.$$

Возникающие при вычислениях (6) и (7) значения z_{N+1} не влияют на S_{ij} , поэтому могут быть выбраны произвольными, например $z_{N+1} = 2z_N - z_{N+1}$.

Из формул (7) видно, что в них не содержатся возрастающие экспоненты, а затухающие члены входят только в комбинации с $J_{ij}(n)$, вообще не содержащими экспоненциально возрастающих и затухающих членов. По этим причинам наши рекуррентные соотношения (7) более пригодны для численных расчетов, чем предложенные в [2].

Для полного решения задачи о прохождении электронов через многослойную структуру необходимо также задать граничные условия при $|z| \rightarrow \infty$. Будем считать, что в области $z < z_1$ для больших $|z|$ имеется заданная падающая блоховская волна с номером ν_0 и амплитудой $A_{\nu_0}^1 = 1$. В области $z > z_N$ для больших z не должно быть волн, распространяющихся к границе $z = z_N$ и неограниченно возрастающих при $z \rightarrow \infty$ (падающих волн). Следовательно, $B^{N+1} = 0$.

Таким образом, из (5) получаем

$$A_{\nu, \nu_0}^{N+1} = (S_{11}(N))_{\nu, \nu_0}, \quad (8)$$

$$B_{\mu, \nu_0}^1 = (S_{21}(N))_{\mu, \nu_0}. \quad (9)$$

Если нормировать все блоховские функции одинаковым образом, например на единицу, то величины

$$P_{\nu_0} = |A_{\nu, \nu_0}^{N+1}|^2 \nu_0^{N+1} (\nu_0^1)^{-1}, \quad (10)$$

$$R_{\mu_0} = |B_{\mu, \nu_0}^1|^2 \nu_0^1 (\nu_0^1)^{-1} \quad (11)$$

будут коэффициентами прохождения и отражения соответственно. P_{ν_0} определяют плотность вероятности обнаружения электрона в блоховском состоянии $\psi_{\nu_0}^{1, N+1}$ при $z \rightarrow \infty$ при падении на многослойную систему слева от границы $z < z_1$ блоховской волны $\psi_{\nu_0}^1$. Коэффициенты отражения и прохождения должны удовлетворять условию нормировки

$$\sum_{\nu} P_{\nu_0} + \sum_{\mu} R_{\mu_0} = 1 \quad (12)$$

для любых ν_0 , причем в суммы по ν и μ входят только вещественные k_{ν} и k_{μ} . Выполнение условия (12) при проведении численных расчетов служит критерием правильности используемых приближений и точности вычислений.

В нашей работе расчет коэффициентов прохождения проведен для двухбарьерных структур GaAs/Al_xGa_{1-x}As при x , равном 0.3 и 1 для границ, перпендикулярных направлению (001), с шириной барьеров $4a$ и ямы $8a$ (a — постоянная решетки). В качестве границ между разными материалами выбрана плоскость из атомов As. Мы рассматривали нормальное к гетерограницам падение электронов ($k_{||} = 0$) для энергий электронов до ~ 1 эВ. Отсчет энергии — от E_c GaAs.

Для вычисления зависимостей $k_{x(\mu)}^{\beta}(E, k_{||})$ и матриц $J_{ij}(n)$ мы использовали метод модельного псевдопотенциала [8], позволяющий с высокой точностью получать различные параметры зонного спектра твердых растворов алмазоподобных соединений. Проведенные нами исследования показали, что в интересующем нас интервале энергий приемлемый компромисс между требованиями точности и разумным расчетным временем достигается при использовании базиса из 27 плоских волн. Для решения задачи о туннелировании электронов необходимо знать относительное положение зонных спектров компонент гетероперехода. Основной физичес-

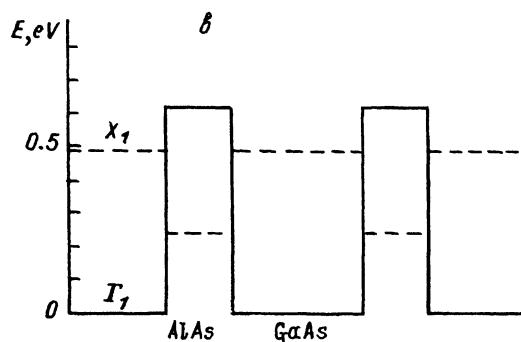
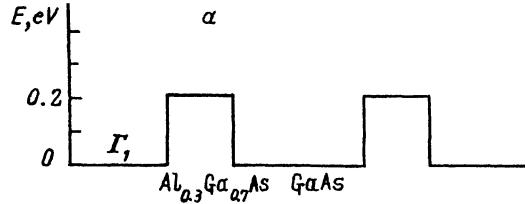


Рис. 1. Разрывы нижних зон проводимости в двухбарьерной структуре $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ при $x = 0.3$ (а) и $x = 1$ (б).

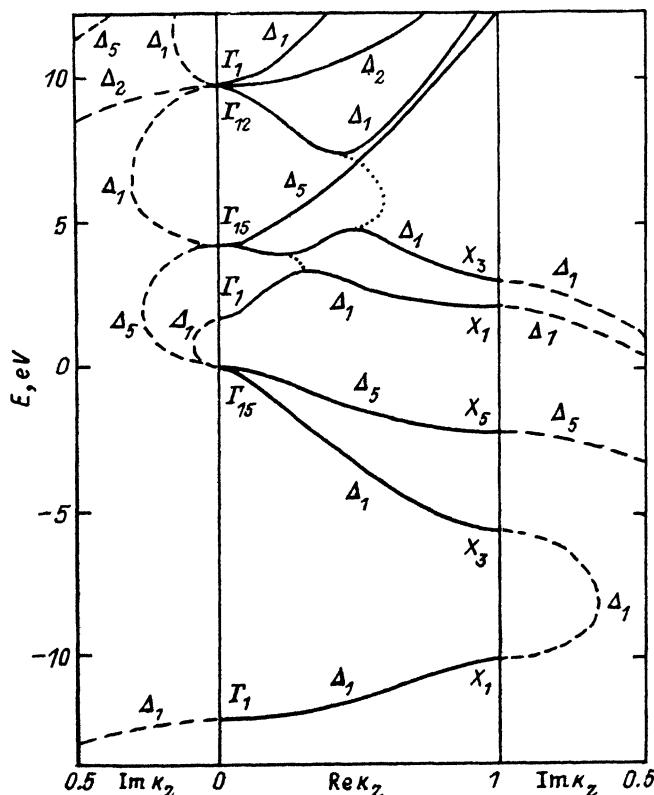


Рис. 2. Комплексная зонная структура GaAs вдоль направления (001). Значения волнового вектора приведены в единицах $2\pi/a$.

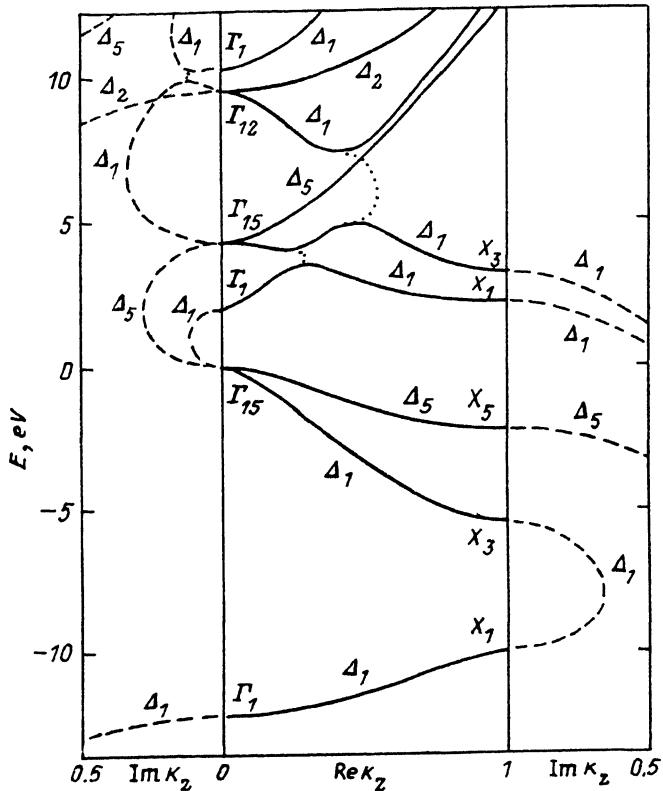


Рис. 3. Комплексная зонная структура $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$.

кой причиной возникновения разрывов зон является различие потенциалов v_{Ga} и v_{Al} . Поскольку $\Delta = v_{\text{Ga}} - v_{\text{Al}}$ мал по сравнению с v_{Ga} и v_{Al} , разрывы зон могут быть найдены в первом порядке теории возмущений к виртуальному кристаллу со средним между компонентами гетероперехода потенциалом. С полученными таким образом разрывами зон и вычисленными энергиями для нижних зон проводимости мы построили профили зон в двухбарьерных структурах $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ (рис. 1). Отметим, что при выбранном базисе экстремумы в энергетических зонах в точке X не получаются, но имеются минимумы в точках k_{0z} вблизи X с энергиями $E(k_{0z})$, которые для простоты далее обозначены через E_x . Из рис. 1 видно, что в $\text{GaAs}/\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$ барьеры и ямы для различных состояний расположены в различных энергетических интервалах, тогда как в GaAs/AlAs профили Γ_1^c - и X_1^c -состояний перекрываются.

Вычисление $k_{zp}^{l,g}(\omega)$ (вещественных линий) и $\psi_{v(\omega)}^{l,g}$ (так называемой комплексной зонной структуры) мы провели с использованием процедуры, предложенной в [9]. Результаты расчета вещественных линий с $|Im k_z| < \pi/a$ приведены на рис. 2–4. На этих рисунках, кроме обычного зонного спектра для вещественных k_z , изображенного сплошными линиями, штриховыми показаны вещественные линии для комплексных k_z . Слева от Γ приведены зависимости для чисто мнимых k_z , справа от X – изменение $Im k_z$ при $Re k_z = k_{0z}$. Точечными кривыми изображены вещественные линии, связывающие экстремальные зонные энергии соседних зон одинаковой симметрии. Всего в базисе из 27 плоских волн получается 13 неэквивалентных $k_{zp}(E)$ и 13 – $k_{zp}(E)$, т. е. имеется 13 падающих и 13 отраженных блоховских волн. Вблизи краев зоны проводимости вещественные линии

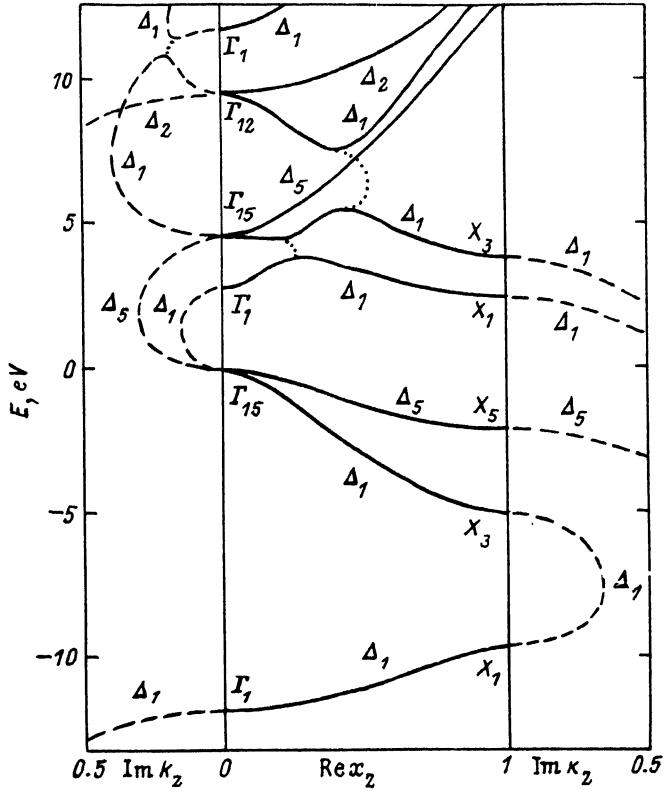


Рис. 4. Комплексная зонная структура AlAs.

симметрии Δ_1 можно разделить на две группы. В первую входят вещественные линии, соответствующие нижней зоне проводимости (вещественные k_z), петли симметрии Δ_1 , соединяющие Γ_1^c и Γ_{15}^v (чисто мнимые k_z), и линии, уходящие на бесконечность из $E_{x_1^c}$ и $E_{x_3^c}$. Длины затухания таких состояний — порядка нескольких ангстрем и более. В другую группу входят вещественные линии, связанные с вышележащими зонами проводимости с длинами затухания $< 0.1 \text{ \AA}$. Вещественные линии симметрии $\Delta_3 + \Delta_4$ мы не рассматриваем, поскольку в нашей задаче падающие волны имеют симметрию Δ_1 .

Результаты расчета коэффициента прохождения $P(E)$ приведены на рис. 5, 6. Сплошными линиями изображены результаты, полученные в точном расчете $P(E)$. Наряду с этим для изучения роли многозонных эффектов во внутридолинных $P(E)$ [$v = v_0$ в формуле (10)] были проведены также расчеты для независимых Γ - и (X_1, X_3) -долин в двух модификациях. Первая соответствует стандартному однодолинному (Γ или X_1) приближению метода эффективной массы, в котором предполагается идентичность периодических частей блоховских функций компонент гетероперехода. При этом эффективные массы брались равными значениям на дне Γ - и X_1 -долин. Этому варианту на рис. 5, 6 соответствуют точечные кривые. Во второй модификации одна Γ -долина и пара (X_1, X_3) -долин «расцеплялись» между собой и с другими состояниями путем обращения в нуль недиагональных по номерам долин элементов матрицы J_{ij} на каждой границе. В отличие от первой модификации здесь учитываются эффекты непарараболичности закона дисперсии, различия периодических частей функций и связь между X_1 - и X_3 -долинами. Кроме того, при $E > E_{x_1}$ (GaAs) в системе GaAs/AlAs в этом

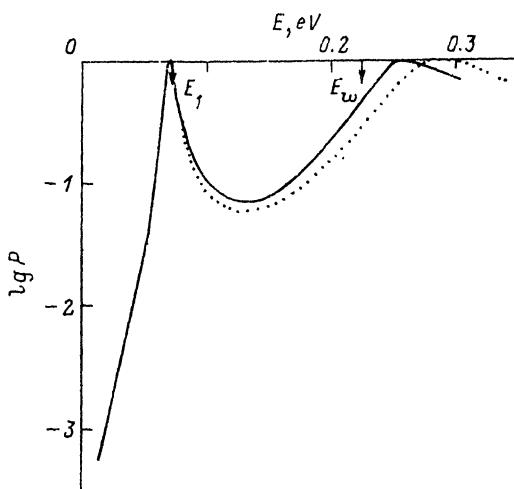


Рис. 5. Коэффициент прохождения $P(E)$ электронов через двухбарьерную структуру GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As.

варианте появляется еще один канал в $P(E)$, соответствующий падающим X_1 -электронам GaAs. Результаты, полученные во второй модификации, показаны на рис. 5, б штриховой линией.

Перейдем к качественному анализу зависимостей $P(E)$. Наблюдаемые структуры в $P(E)$ можно достаточно просто соотнести со связанными и резонансными состояниями в изолированных ямах и барьерах. Для системы GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As $P(E)$ имеет достаточно простой вид. Наблюдаемый при $E = 0.07$ эВ единственный подбарьерный резонанс обусловлен взаимодействием с локализованным в яме GaAs состоянием, для которого из решения задачи о собственных энергиях в одиночной квантовой яме конечной глубины (с учетом зависимости m^* от энергии и состава) получается энергия, равная 0.073 эВ (показана на рис. 5 стрелкой). Надбарьерный резонанс при $E = 0.26$ эВ в основном связан с максимумом в $P(E)$ при $E_w = 0.224$ эВ для одиночной квантовой ямы GaAs. Результаты многодолинного и однодолинного (во втором варианте) расчетов $P(E)$ близки и в масштабе рис. 5 неразличимы. Использование приближения эффективной массы дает заметное отличие от этих расчетов, в основном состоящее в сдвиге кривой $P(E)$ в сторону больших энергий. Большая часть этого сдвига объясняется энергетической зависимостью эффективной массы.

Для двухбарьерной структуры GaAs/AlAs зависимость $P(E)$ имеет более сложный вид (рис. 6). При $E < E_{X_1}$ (GaAs) первый (наиболее узкий) Г-резонанс ($E = 0.10$ эВ) практически одинаково описывается во всех вариантах расчета. Его положение близко к энергии низшего (s -подобного) состояния изолированной квантовой ямы ($E_1^r = 0.102$ эВ), которое несколько завышено за счет конечности ширины барьера. Резонанс при $E = 0.36$ эВ также связан с Г-долиной, что видно из сравнения результатов многодолинного расчета с $P(E)$, полученной во втором варианте однодолинного расчета. Учет энергетической зависимости m_r^* в приближении эффективной массы почти полностью устранил сдвиг $P(E)$ вправо в этой области энергий. При $E > E_{X_1}$ (AlAs) взаимодействие падающей волны с состояниями, происходящими из X_1 - и X_3 -долин AlAs, усиливается. При энергиях, близких к уровням связанных состояний, в X_1 -яме AlAs возникают так называемые резонансы Фано [10]. Второй из этих резонансов попадает на Г-резонанс и приводит к уменьшению высоты и расщеплению последнего. Для ослабления такого

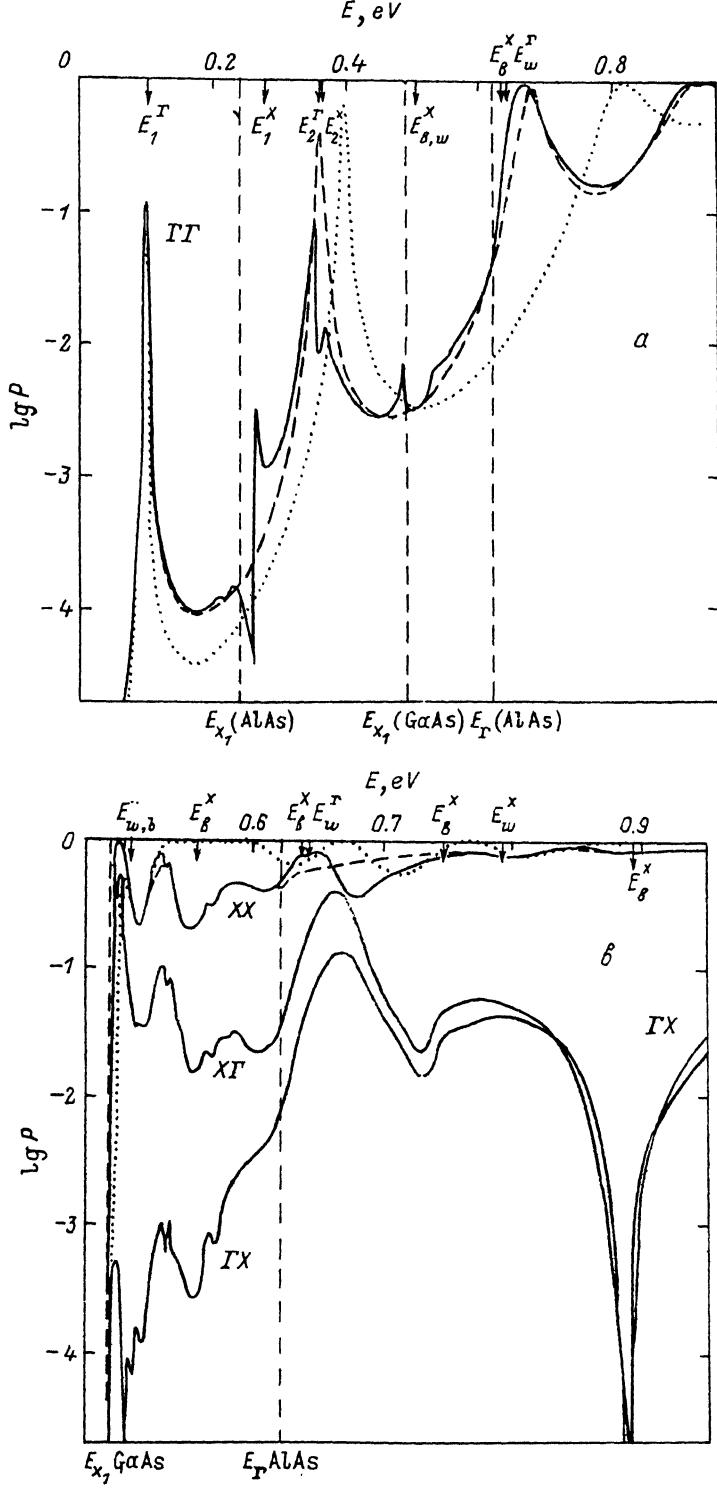


Рис. 6. Коэффициент прохождения электронов через двухбарьерную структуру GaAs/AlAs для различных видов рассеяния: *a* — ГГ; *б* — ХХ, ХГ, ГХ.

го неблагоприятного влияния X_1 -долин AlAs на Г-резонанс двухбарьерной структуры необходимо изменить ее геометрические размеры (толщины ям или барьера). При $E > E_{X_1}$ (GaAs) возможны два падающих и два прошедших Γ_1^c - и X_1^c -подобных состояний GaAs. Соответствующие им коэффициенты прохождения обозначены на рис. 6 символами $\Gamma\Gamma$, ΓX , XX , $X\Gamma$, где первая буква описывает характер падающей волны, а вторая — прошедшей. Из рис. 6 видно, что «недиагональные» междолинные коэффициенты прохождения ($X\Gamma$ и ΓX) в основном на порядок меньше «диагональных» внутридолинных $P(E)$ ($\Gamma\Gamma$ и XX). Особенности в $P(E)$ для XX -, $X\Gamma$ - и ΓX -рассеяний при энергиях 0.49, 0.52 и 0.64 эВ обусловлены взаимодействием с первыми надбарьерными и надъямными X_1 -резонансами изолированных ямы и барьера. Это вытекает из анализа проведенных нами расчетов $P(E)$ двухъямной (X_1) структуры в однодолинном приближении в зависимости от размеров ямы и барьера. Результаты точного и двухдолинного (X_1 , X_3) расчетов для XX -рассеяния отличаются от однодолинного (X_1) приближения в основном из-за энергетической зависимости эффективной массы. Имеется также возмущающее влияние X_3 -долин. В свою очередь двухдолинный и точечный расчеты заметно различаются лишь в области энергий, находящейся около надъямного Г-резонанса ($E_w^r = 0.641$ эВ), где взаимодействие X -состояний с Г-долиной наиболее существенно. Этот одноя姆ный Г-резонанс проявляется также в надбарьерной структуре (максимуме) в $P(E)$ для $\Gamma\Gamma$ -рассеяния при $E \approx 0.67$ эВ, причем ее левое плечо в точном расчете имеет более резкий наклон (по сравнению с однодолинной моделью) вследствие влияния надбарьерного X_1 -резонанса ($E_b^X = 0.636$ эВ). При $E > 0.6$ эВ состояния из Γ_1^- и X_1 -долин GaAs сближаются, в результате чего коэффициенты прохождения ΓX и $X\Gamma$ становятся почти равными. Другие структуры в $P(E)$ имеют существенно двухбарьерную или двухъямную природу.

Таким образом, если результаты многодолинного точного расчета для системы GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As достаточно хорошо описываются однодолинной (Γ) моделью в рассмотренном интервале энергий, то в GaAs/AlAs для $E > E_{X_1}$ (AlAs) эта модель становится несостоительной. Основной причиной наблюдающихся расхождений являются существенное усиление роли ΓX -взаимодействия при перекрывании профилей Γ_1^c - и X_1^c -состояний. Поэтому для адекватного описания таких систем модель изначально должна включать в себя Γ - и X -состояния одновременно. Для определения минимального набора таких состояний мы провели анализ матриц $J_{ij}(n)$. Как оказалось, в них можно выделить блок 3×3 из сильно взаимодействующих друг с другом Γ_1^c -, X_1^c - и X_3^c -состояний. Матричные элементы, связывающие эти состояния с остальными, малы и резко убывают с ростом мнимой части волнового вектора последних. Выделение такого блока в матрицах $J_{ij}(n)$ обусловлено ранее отмеченным разделением вещественных линий. Непосредственные расчеты $P(E)$ структуры GaAs/AlAs, проведенные при условии обращения в нуль всех матричных элементов $J_{ij}(n)$, отвечающих взаимодействию Γ_1^c -, X_1^c - и X_3^c -состояний с остальными, приводят к результатам, практически совпадающим с точным расчетом $P(E)$. Таким образом, мы приходим к трехдолинной модели гетероструктуры GaAs/AlAs как наиболее обоснованному способу приближенного описания процессов туннелирования.

В следующих публикациях мы предполагаем развить трехдолинную модель в рамках метода эффективной массы с использованием граничных условий для огибающих функций, получаемых из рассчитанных матриц J_{ij} .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] D. Y. Ko, J. C. Inkson. Semicond. Sci. Techn., 3, 791 (1988).
- [2] D. Y. Ko, J. C. Inkson. Phys. Rev. B, 38, 9945 (1988).
- [3] T. Ando, S. Wakahara, H. Akera. Phys. Rev. B, 40, 11609 (1989).

- [4] T. Ando, H. Akera. Phys. Rev. B, **40**, 11619 (1989).
 - [5] K. V. Rousseau, K. L. Wang, J. N. Schulman. Appl. Phys. Lett., **54**, 1341 (1989).
 - [6] C. G. Van de Walle, R. M. Martin. Phys. Rev. B, **35**, 8154 (1987).
 - [7] Туннельные явления в твердых телах (под ред. Э. Бурштейна, С. Лундквиста). М. (1973)
 - [8] В. А. Чалдышев, С. Н. Гриняев. Изв. вузов СССР, Физика, **26**, 38 (1983).
 - [9] Y. C. Chang, J. N. Schulman. Phys. Rev. B, **25**, 3975 (1982).
 - [10] U. Fano. Phys. Rev., **124**, 1866 (1961).
-

Редактор Л. В. Шаронова